

# Tillverkning av uppladdningsbara batterier och halvledare

	Vaisalas daggpunktsprob	CRDS	Transmitter med kyld spegel
Td-mätområde*	-80 °C...+20 °C	-100 °C...-50 °C	-70 °C...+20 °C
Mätningar på plats	Ja	Nej, kräver provtagning och stor tryckskillnad	Nej, kräver provtagning
Td-noggrannhet under laboratorieförhållanden*	+/-2 °C	+/-0,2 °C	+/-0,2 °C
Tryckområde*	1-50 bar	1-5 bar	Endast ~1 bar
Beroende av atmosfäriska förhållanden	Ej beroende	Beroende. Kräver stabila atmosfäriska förhållanden. Provtagning kan generera fel i miljöer utanför laboratorium.	Beroende. Lägsta daggpunkt ökar om omgivningstemperaturen höjs. Provtagning kan generera fel i miljöer utanför laboratorium.
Svarstid*	Minuter	Tiotaler minuter	Timmar
Sensitivity (Känslighet)	Hög	Låg (kan inte upptäcka snabba förändringar, medelvärdesmätning)	Låg (kan inte upptäcka snabba förändringar, medelvärdesmätning)
Storlek	Liten och lätt. Får enkelt plats på olika platser	Medelstor, ca 10 kg	Från stor och tung till medelstor
Kräver regelbunden service av operatör	Krävs ej	Krävs ej	Krävs
Innehåller komponenter som kräver service	Krävs ej	Krävs ej i ren miljö	Krävs (t.ex. Peltier)
Lokal kalibrering/support tillgänglig	Ja	Förmodligen inte	Förmodligen inte
Beroende av bakgrundsgaser	Litet	Potentiellt stort	Potentiellt avgörande

\* Typiska värden vid tillverkning av batterier och halvledare